Рассмотренная выше ситуация без труда обобщается на случай, когда тело находится на i > 2 участках с известными координатами концов и с коэффициентами трения  $\mu_i$ , а также на случай, когда упругие характеристики участков с различными коэффициентами трения различны. Представляет интерес обобщение рассмотренной модели для ситуации со случайно распределенным коэффициентом трения, а также для ситуации с плоскопараллельным движением твердого тела – к этому классу задач принадлежит задача определения движения автомобиля при наличии заноса с учетом эффекта скатывания материала колес.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- С.В.Босаков. К устойчивости стержней на упругом основании/ Весці АН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. 1994. №1. - С.29-33.
- А.Н.Прокопеня, Н.И.Чопчиц. Р.Краглер. Анализ одномерного движения протяженного тела по поверхности с переменным коэффициентом трения/ Тезисы докл. междунар. математич. конф. «Дифференциальные уравнения и системы компьютерной алгебры» (19-22 сент. 2000 г., Брест). Брест, БрГУ, 2000. С.60.

## УДК 539.216:535.36

# Каролинский В.Г., Пекун А.И., Луковский С.В., Сазонов М.И., Хвисевич В.М.

# ПОЛУЧЕНИЕ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЕНОК ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ (ВПУ-2)

Анализ научно-технической и патентной информации [1-2]показывает, что в последнее время учеными различных стран интенсивно ведутся исследования по выращиванию алмазоподобных и алмазных пленок (АП), а также разрабатываются соответствующие технологии нанесения таких пленок на детали машин, инструмент, пресс-формы, оптические детали и т.д. Потенциальные возможности использования АП в различных областях науки и техники основаны на уникальных свойствах алмаза: высокая теплопроводность, химическая инертность, низкий коэффициент трения, высочайшая твердость и т.д.

На рисунке 1 приведена фотография плазменновакуумной установки (ВПУ-2) предназначенной для получения алмазоподобных пленок, которая разработана Брестским политехническим институтом совместно со Сморгонским заводом оптического станкостроения.

Установка предназначена для нанесения тонких износостойких алмазоподобных покрытий способом химического осаждения из газовой фазы с применением высокотемпературной плазменной струи.

В состав установки входят:

- высокоэнтальпийный плазмотрон мощностью 60 кВт;
- откачной пост;
- система подачи газа в рабочую камеру и плазмотрон;
- пульт управления.

Технические характеристики установки приведены в таблице 1.

Относительной особенностью данной установки в сравнении с аналогами является применение мощного плазмотрона постоянного тока с межэлектродной вставкой (МЭВ) и газовой завесой стенок разрядной камеры, генерирующего сверхзвуковую струю аргона мощностью до 60 кВт.

Разработанный плазмотрон с МЭВ (рис. 2) состоит из внутреннего кольцевого электрода - катода 1, выходного электрода - анода 2, между которыми устанавливается секционированная межэлектродная вставка. МЭВ набрана из интенсивно охлаждаемых водой электрически изолированных друг от друга медных секций - шайб 3 с цилиндрическими отверстиями диаметром 4-10 мм. Для обеспечения стабильно-



Рисунок 1. Плазменно-вакуумная установка (ВПУ-2)

го горения дуги на оси электроразрядной камеры и исключения шунтирования дуги в канале плазмотрона толщина сек-

Каролинский Владимир Григорьевич. К.п.н, доцент каф. физики Брестского государственного технического университета. Пекун Александр Иванович. Инженер, научный сотрудник каф. СМиТМ Брестского государственного технического университета.

**Луковский Сергей Викторович.** Инженер, аспирант каф. СМиТМ Брестского государственного технического университета. **Сазонов Михаил Иванович.** Д.т.н., профессор каф. СМиТМ Брестского государственного технического университета. **Хвисевич Виталий Михайлович.** К.т.н., зав. каф. СМиТМ Брестского государственного технического университета. Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267.

Физика, математика, химия

#### Технические характеристики установки

### Таблица 1

Максимальная мощность, потребляемая установкой, кВт	65
Рабочее давление в камере, Па	3002000
Время достижения давления 0.1Па, необходимого для ионной очистки, мин	15
Диаметр рабочей камеры, мм	700
Высота рабочей камеры, мм	700
Масса установки, кг	1550
Число плазмотронов, шт.	1
Расход аргона, л/мин	640
Расход водорода, л/мин	112
Расход ацетилена или метана, л/мин	0,11,4
Расход охлаждающей воды, л/час	800
Скорость роста пленки, мкм/ч	не менее 20



Рисунок 2 Принципиальная схема плазмотрона с МЭВ

1 - катод, 2 - анод, 3 - секции МЭВ, 4 - дуга, 5 - изолятор, 6 - кольцо закрутки потока рабочего газа,  $G_0$  - основная подача газа,

*G*<sub>*i*</sub> - дополнительная подача газа для организации газовой завесы стенок разрядной камеры.

ций выбирается такой, чтобы падение потенциала на участке дуги внутри секции не превышало суммарную величину анодного и катодного падений потенциалов.

С целью увеличения ресурса работы катода при нагреве аргона в плазмотроне применен внутренний электрод из тугоплавкого материала в виде вольфрамового стержня диаметром 3-4 мм, который запрессован в медную обойму и выступает из нее на 10-20 мм. Проведенные длительные испытания плазмотрона при токах дуги 50-320 А и работе его вместе с вакуумной камерой и осаждении алмазоподобных пленок показали, что ресурс разработанного катода составляет не менее 50-60 часов.

С целью генерации сверхзвуковой плазменной струи анод в разработанной конструкции плазмотрона выполнен в виде конического сопла с углом раскрыва 14°, причем, его входная часть, протяженностью 1, 5-2 калибра, изготовлена в виде цилиндра диаметром 4-10 мм.

Электроизоляция между секциями МЭВ и электродами обеспечивается прокладками 5 из вакуумной резины. Рабочий газ - аргон с расходом G = 6 - 28 л/мин подается через

кольцо закрутки. Для организации газовой завесы стенок канала с целью снижения тепловых потерь в секции и устойчивого горения дуги на переходном участке течения начиная с четвертой секции от катода в щели между секциями подается рабочий газ с расходом G = 0 - 0.3 л/мин в каждую щель.

Диаметр электроразрядной камеры и сопла плазмотрона может составлять 4; 6; 8 или 10 мм. Число секций МЭВ также может изменяется от 3 до 24. Это позволяет заранее определить необходимую эксплуатационную мощность плазмотрона.

Исследования показали, что вольт-амперные характеристики плазмотрона с МЭВ являются восходящими при отношении тока к диаметру канала электроразрядной камеры более 30. Это позволяет использовать стандартные силовые источники питания плазмотрона с жесткой характеристикой.

Схема реактора установки ВПУ-2, используемого для осаждения алмазоподобных пленок, приведена на рисунке 3. Плазмотрон (1) позволяет генерировать плазменную аргоновую струю с дозвуковым или сверхзвуковым истечением (рис. 1). Введение реагентов в такую струю и разрядную камеру



Рисунок 3. Схема реактора установки ВПУ-2 1 - плазмотрон с МЭВ; 2 - химический реактор; 3 - кольцо для подачи газов в реактор, 4 - подложка, 5 - водоохлаждаемый подложкодержатель, 6- термопара.

плазмотрона позволяет изменять процесс роста алмазоподобных пленок CDV методом. Химические реагенты ( $H_2$ ,  $C_2$  $H_2$ ,  $CH_4$ ) могут инжектироваться в плазменную струю как через отверстия в кольцевой трубке 3, так и через секции в разрядную камеру плазмотрона. Площадь осаждения пленки может изменяться как изменением расстояния h между плазмотроном и подложкой 4, так и изменением конфигурации выходного канала анода-сопла. Осаждение пленок можно производить на различные подложки (молибден, медь, сталь и т.д.), которые прижимаются к водоохлаждаемому подложкодержателю 5. Температура подложки может регулироваться как расходом воды, так и мощностью плазмотрона. Контроль температуры осуществляется термопарой 6.

Таким образом, как вытекает из вышесказанного, установка типа ВПУ-2 позволяет в широких диапазонах изменять параметры ее работы, что, в конечном итоге, влияет на качество и скорость роста алмазоподобных пленок.

В настоящее время в БГТУ проводятся исследования по осаждению алмазоподобных пленок на подложки и инструменты из различных материалов при различных отношениях расхода *Ar*, *H*<sub>2</sub>, *CH*<sub>4</sub>, *C*<sub>2</sub>*H*<sub>2</sub>.

Осаждение пленок проводилось при мощности плазмотрона 5-20 кВт, расходах аргона 3-6 л/мин, метана 0,3-2 л/мин, водорода 0,4-1,2 л/мин, расстояниях от плазмотрона до подложки 40-120 мм, давлении газа в реакторе 150-280 Па. В частности, осаждение пленок производилось на режущие пластины типа ТВК. Практические эксперименты показали, что ресурс работы таких пластин увеличился в 4-5 раз. В качестве основного метода исследования структуры покрытий нами был выбран метод комбинационного рассеяния света (КРС). Спектры КРС регистрировались при комнатной температуре с помощью спектрометра модели 1403 фирмы Spex. Регистрация спектров осуществлялась по схеме обратного рассеяния, спектральная полуширина щелей спектрометра составляла 2-3 см<sup>-1</sup>. Возбуждение производилось излучением  $Ar^*$  лазера с длиной волны 488 нм и 514,5 нм. Мощность



- Рисунок 4. Спектры КРС углеродных пленок, выращенных с использованием медных столиков различной толщины (во всех экспериментах расход метана был 0,2 л/час);
- Толщина столика 4 мм, время нанесения 60 мин (плёнка №166);
- Толщина столика 2мм, время нанесения 15 мин (плёнка №137);
- 3 Без столика, время нанесения 20 мин (пленка №153).

излучения на образце составляла 0,3-0,4 Вт, а диаметр возбуждающего пучка составлял ~ 20 нм.

Характерный спектр КРС углеродных пленок, выращенных при различных температурах подложки и времени напыления показан на рисунке 4

На рисунке 4 показано изменение характера спектров КРС углеродных пленок в зависимости от толщины водоохлаждаемого столика при прочих равных условиях нанесения. Температура на поверхности подложки увеличивается с ростом толщины столика. Спектр КРС пленки, выращенной при максимальной температуре (~650° C), состоит из двух широких полос 1350 см<sup>-1</sup> (D –полоса) и 1580 см<sup>-1</sup> (G –полоса) с одинаковой интенсивностью, что позволяет характеризовать ее как алмазоподобную. При снижении температуры на поверхности подложки соотношение интенсивностей D - и G -полос уменьшается. Кроме полосы 1350 см<sup>-1</sup> наблюдаются дополнительны полосы (кривая 1) с максимумами в интервале 1370-1400 см<sup>-1</sup> и 1470-1500 см<sup>-1</sup>. Причем интенсивность полосы 1370-1400 см<sup>-1</sup> превосходит интенсивность D- полосы. Снижение интенсивности и ущирение полос **D**- и **G**- полос, а также появление в промежуточной области между двумя основными полосами дополнительных полос говорит об уменьшении размеров как *sp*<sub>3</sub> -, так и *sp*<sub>2</sub> гибридизированных кристаллических кластеров. Это уменьшение размера кристаллических кластеров прежде всего может происходить за счет изменения температуры подложки.

На основании проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:

- 1. Установка ВПУ-2 позволяет в широких диапазонах регулировать скорость и качество роста алмазоподобных пленок CVD –методом.
- 2. Осажденные алмазоподобные пленки на режущий инструмент позволяют увеличивать их износостойкость.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 Л.М.Блинов, Ю.В.Гуляев, А.В.Долголаптев, И.П.Шклов. Алмазные пленки: перспективные направления использования и их получение в плазме ВЧ- и СВЧ- разрядов пониженного и атмосферного давления.//Радиотехника и электроника, 1996г., том 41, №4, стр. 389-403.

 V.G.Perevezev, V.I.Konov, V.G.Ralchenko, A.S.Pozharov, S.Metev, H.Btecht, G.Sepold. Parametric studies of diamond

УДК 517.948.34

Пархимович И.В.

film deposition by dc arc-jet technique// Proceedings of 4<sup>th</sup> International Symposium on Diamond Films and Related Materials. Kharkov, Ukraine, September 20-22,1999, p. 110-113.

### О ВЕЗДЕ РАЗРЕШИМЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим краевую задачу для линейного интегродифференциального (и.-д.) уравнения

$$T_{I}u: \begin{cases} Tu \equiv \dot{u}(x) + P(x)u(x) + \int_{0}^{x^{n}} K(x,s)\dot{u}(s)ds = f(x) \\ u(0) - \int_{0}^{1} M(x)\dot{u}(x)dx = 0 \end{cases}$$
(1)

в которой предполагается:

1. действительная *n*-вектор-функция u(x) действительного переменного *x* принадлежит линеалу  $D_2^n[0,1]$  абсолютно непрерывных *n*-вектор-функций, производная которой  $\dot{u}(x) \in L_2^n[0,1];$  *n*-вектор-функция  $f(x) \in L_2^n[0,1];$ 

- P(x), M(x), K(x,s) n x n матрицы, элементы которых суммируем с квадратом соответственно в областях [0,1], [0,1] и [0,1] x [0,1];
- 3. постоянная  $\alpha \in [0,1]$ ; при  $\alpha = 1$  уравнение Tu=f представляет и.-д. уравнение Вольтерра, а при  $\alpha = 0$  и.-д. уравнение Фредгольма.

Следовательно, уравнение *Tu=f* (1) является обобщением этих известных видов и.-д. уравнений.

Для выяснения разрешимости краевой задачи (1) определим дефектное подпространство сужения оператора  $D = \frac{d}{dx}$ 

на n-векторно-значную функцию u краевым условием задачи(1)

Su: 
$$\begin{cases} Du \equiv \dot{u}(x) \\ u(0) - \int_{0}^{1} M(x) \dot{u}(x) dx = 0. \end{cases}$$
 (2)

Уравнение Su=f разрешимо при  $\forall f(x) \in L_2^n[0,1]$ . Дей-

ствительно, полагая  $u(x) = \int_{0}^{x} f(t) dt + C$  и подставляя его в краевое условие, получим значение



уравнению Su = f при  $\forall f \in L_2^n[0,1]$ . Таким образом, имеет место

*Лемма* 1. Дефектное подпространство оператора S(2) равно нулю, т.е.  $Z_s^+ = 0$ .

Пусть матрица P(x) произвольная, удовлетворяющая условию 2. Если при тех же ограничениях матрицы M(x) и K(x,s) произвольны, то, очевидно, что краевая задача (1) не разрешима при  $\forall f(x) \in L_2^n[0,1]$ .

Однако если специальным образом выбрать M(x) и K(x,s) в некоторой части квадрата  $0 \le x$ ,  $s \le 1$ , то окажется, что краевая задача (1) станет разрешимой при  $\forall f(x) \in L_2^n[0,1]$  и согласно терминологии [1] такое уравнение  $T_1 u = f$  называется везде разрешимым. Осуществлять этот специальный выбор матриц M(x) и K(x,s) будем с помощью *s*-сопряженного оператора  $T_{1s}^*$ , используя аналог формулы Лагранжа [2], получаемой интегрированием по частям при любых  $u \in D_2^n[0,1]$ ,  $u \in L_2^n[0,1]$  и  $\forall v \in L_2^n[0,1]$ :

$$\int_{0}^{1} Tuv dx = \int_{0}^{1} \dot{u}v dx + \int_{0}^{1} Puv dx + \int_{0}^{1} \int_{0}^{x^{\alpha}} K(x,s) \dot{u}(s) dsv(x) dx =$$

$$= \int_{0}^{1} \dot{u}v dx + u(x) \int_{1}^{x} P^{T}(s) v(s) ds \int_{x=0}^{1} +$$

$$+ \int_{0}^{1} \dot{u}(x) \int_{x^{\frac{1}{\alpha}}}^{1} P^{T}(s) v(s) ds dx +$$

$$+ \int_{0}^{1} \dot{u}(x) \int_{x^{\frac{1}{\alpha}}}^{1} K^{T}(s,x) v(s) ds dx = u(0) \int_{0}^{1} P^{T}(s) v(s) ds +$$

$$+ \int_{0}^{1} \dot{u}(x) \left( v(x) + \int_{x}^{1} P^{T}(s) v(s) ds + \int_{x^{\frac{1}{\alpha}}}^{1} K^{T}(s,x) v(s) ds \right) ds dx = u(0) \int_{0}^{1} P^{T}(s) v(s) ds +$$

Итак, аналог формулы Лагранжа для и.-д. оператора T(1) имеет вид

Пархимович Игорь Владимирович. Доцент каф. высшей математики Брестского государственного технического университета.

Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267.